

ИЗВЕСТИЯ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
Института им. С.М.КИРОВА

№ 251

1970

Изменение радиационно-химической
стабильности PbN_6 гетерофазными добавками

Ю.А. Ветхаров, С.И. Рябых, В.Д. Минаков

(Представлена научным семинаром кафедры радиационной химии)

Некоторые наблюдения последних лет [1-9] позволяют предположить, что перспективная возможность направленного изменения радиационно-химической стабильности твердых солей заключается во введении в них гетерофазных добавок полупроводников. В настоящей работе рассмотрено влияние таких добавок (полупроводниковых окислов) на радиолиз PbN_6 . Выбор PbN_6 для исследования обусловлен его практической важностью как ИВЕ, и тем, что PbN_6 — удобный модельный объект для изучения твердофазного разложения. Для получения информации о направлении электронных переходов при радиолизе исследовалась электропроводность и T^- -проводимость слоёв PbN_6 — окисел.

МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА.

Поликристаллический PbN_6 получали обменной реакцией между водными растворами NaN_3 и $Pb(NO_3)_2$. Определенное химическим анализом содержание N_3^- в PbN_6 составляло $98 \pm 2\%$. Гетерофазными добавками служили окислы ZnO , CaO , Co_2O_3 и NiO . Для получения нужного состава PbN_6 и окисел тщательно перемешивались механически. В экспериментах использовался порошок фракции 30–60 меш. Использованный технический NaN_3 был дважды перекристаллизован, прочие реагенты имели квалификацию "хч".

Источником излучения служила рентгеновская трубка ВБТМ-200, работавшая в режиме 200 кв, 20 ма, мощность дозы определялась ферросульфатным дозиметром. Радиолиз проводили в вакууме при остаточном давлении 10^{-2} - 10^{-4} мм.рт.ст. в области температур 0-100°C, регистрируя количество выделяющегося при облучении газа. Чувствительность объемной установки составляла $0,7 \cdot 10^{-8}$ моль.

При изучении электрофизических свойств слоёв PbN_6 -окисел прессованные таблетки PbN_6 и соответствующего окисла приводили в плотный механический контакт. Измерения проводили в поле излучения, в условиях, аналогичных условиям радиолиза, измеряли σ -проводимость и σ -з.д.с. Чувствительность измерительной схемы по току составляла 10^{-14} а.

РЕЗУЛЬТАТЫ

I. При введении в PbN_6 окислов ZnO , CdO , Co_2O_3 и MnO радиационно-химическая стабильность PbN_6 изменяется. Добавки ZnO и CdO значительно ускоряют выделение азота из PbN_6 при облучении, добавки MnO и Co_2O_3 - замедляют его (см. рис. I). Как катализитический, так и ингибитирующий эффекты быстро насыщаются с увеличением количества вводимой добавки. Скорость газовыделения для всех изученных никме составов в диапазоне доз $1 \cdot 10^{17}$ - $1 \cdot 10^{19}$ эв/г остаётся постоянной, как это имеет место в случае радиолиза чистого PbN_6 [35]. Изучение температурной зависимости скорости газовыделения показало, что на энергию активации радиолиза PbN_6 введение упомянутых гетерофазных добавок влияния не оказывает: во всех случаях энергия активации процесса газовыделения при радиолизе составляла 5 ± 1 ккал/моль, как и для чистого PbN_6 . После прекращения облучения га-

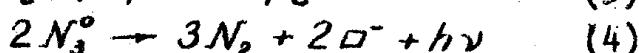
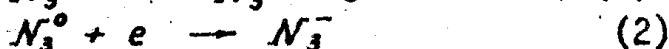
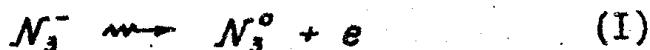
зозидение из составов PbN_6 -окисел продолжалось, закономерности его аналогичны найденным для чистого PbN_6 [3-4].

2. При отсутствии облучения слои PbN_6 -окисел не является источником сколько-нибудь заметных э.д.с.. Однако при облучении слоев с контактирующими таблеток снимаются заметные Γ -э.д.с. При этом PbN_6 , облучаемый в контакте с ZnO и CdO , заряжается до положительного потенциала, а в контакте с NiO - до отрицательного. Вольтамперные характеристики для Γ -токов в исследованных слоях приведены на рис. 2. Для слоев $PbN_6 - ZnO$ и $PbN_6 - CdO$ величина Γ -тока мало зависит от направления тока, тогда как в слоях $PbN_6 - Co_2O_3$ и $PbN_6 - NiO$ наблюдается довольно значительный эффект выпрямления, причем, запорным является направление тока от окисла к PbN_6 .

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследования катализа и ингибирования радиолиза нитратов и NH_4ClO_4 гетерофазными добавками [1-3], а также наши результаты в этом направлении [3] позволяют предположить, что изменение добавками полупроводников скорости радиолиза твердых радиационно-нестабильных солей является результатом донорно-акцепторных взаимодействий между контактирующими партнерами. Смысл влияния контактов состоит в сдвиге равновесия электронных стадий радиолиза. С этим согласуется то обстоятельство, что окислы не изменяют энергию активации распада солей.

В работах [4] была обоснована схема радиолиза PbN_6 , включающая следующие основные элементарные стадии:



Была показана также стационарность при облучении по промежуточным продуктам - радикалам N_3^{\bullet} и электронам проводимости. При этом оснований можно получить следующие выражения для скоростей изменения концентрации N_3^{\bullet} и электронов:

$$\frac{d[N_3^{\bullet}]}{dt} = \kappa_1 J[N_3^{\bullet}] - \kappa_2 [N_3^{\bullet}][e] - \kappa_3 [N_3^{\bullet}]^2 = 0, \quad (I)$$

$$\frac{d[e]}{dt} = \kappa_1 J[N_3^{\bullet}] - \kappa_2 [N_3^{\bullet}][e] - \kappa_3 [T][e] = 0. \quad (II)$$

Учитывая, что скорость радиолиза равна $v = \kappa_4 [N_3^{\bullet}]^2$, из уравнения (II) легко найти стационарную концентрацию электронов:

$$[e] = \frac{\kappa_1 \sqrt{\kappa_4} J[N_3^{\bullet}]}{\kappa_2 \sqrt{\kappa_4} [T] + \kappa_3 \sqrt{v}}, \quad (III)$$

где J - интенсивность облучения,

$[T]$ - концентрация ловушек электронов.

Если N_3^{\bullet} при радиолизе находится в контакте с полупроводником - донором или акцептором электронов, то стационарная концентрация электронов изменится на постоянную величину A (она может быть положительной или отрицательной):

$$[e] = \frac{\kappa_1 \sqrt{\kappa_4} J[N_3^{\bullet}]}{\kappa_2 \sqrt{\kappa_4} [T] + \kappa_3 \sqrt{v}} + A. \quad (IV)$$

Подставив это значение $[e]$ в уравнение (I), можно выразить зависимость скорости радиолиза от величины A в виде:

$$A = \frac{\kappa_1 \kappa_2 \kappa_3 J[N_3^{\bullet}][T]}{\kappa_2 \sqrt{v} (\kappa_3 \kappa_4 [T] + \kappa_2 \sqrt{v})} - \frac{\sqrt{\kappa_4}}{\kappa_2} \sqrt{v}. \quad (V)$$

Графически функция $v = f(A)$ имеет вид, показанный на рис. 3. Из этого графика следует, что при введении в PbN_6 добавки, являющейся донором электронов, скорость радиолиза PbN_6 должна уменьшаться, а при введении акцептора - возрасти.

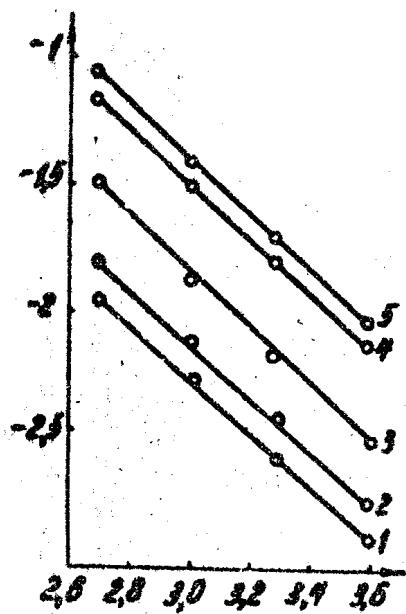


Рис.1. Температурная зависимость скорости радиолиза составов

PbN_6 – окисел
1 = $PbN_6 + 10\% NiO$;
2 = $PbN_6 + 10\% Co_2O_3$;
3 = PbN_6 ;
4 = $PbN_6 + 10\% ZnO$;
5 = $PbN_6 + 10\% CdO$.

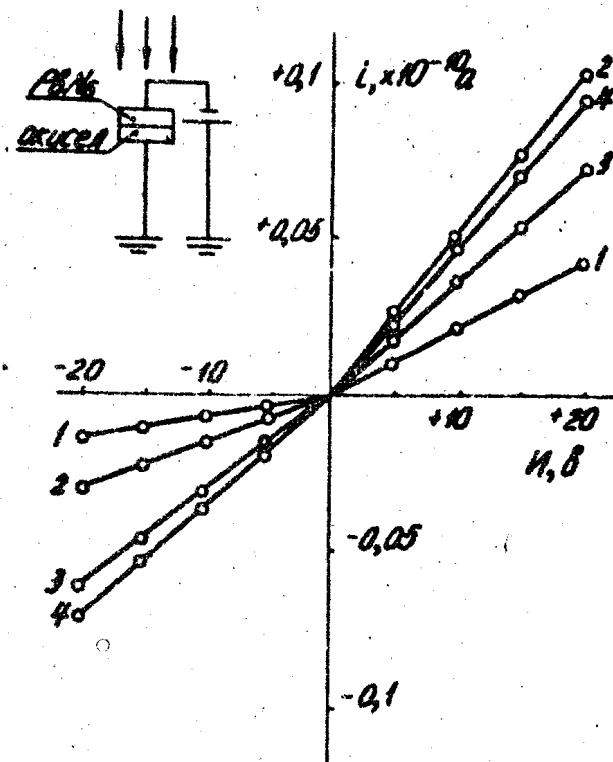


Рис.2. Вольт-амперные характеристики слоёв PbN_6 – окисел в поле излучения ($t = 50^{\circ}C$)

- 1 = $PbN_6 - Co_2O_3$;
- 2 = $PbN_6 - NiO$;
- 3 = $PbN_6 - CdO$;
- 4 = $PbN_6 - ZnO$.

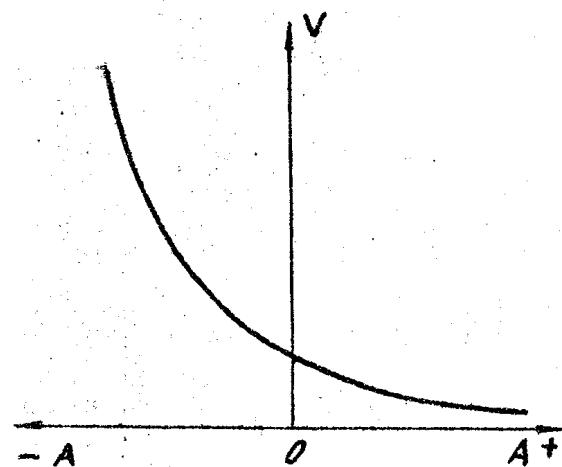


Рис. 3. Зависимость скорости радиолиза PbN_6 от величины А (по уравнению V).

Подобных выводов и следовало ожидать, так как изменение стационарной концентрации электронов должно привести к смещению равновесия в реакции рекомбинации (2) вправо - при введении акцепторов и влево - при введении донора электронов, а это, в свою очередь, изменит стационарную концентрацию N_s и в конечном счете - скорость радиолиза так, как это описано выше.

Характер (направление и количество) обмена зарядов на необлученном контакте определяется качеством контакта и соотношением работ выхода электрона из контактирующих партнеров. Однако при облучении контакта жестким излучением свойства кристаллов, определяющие их донорно-акцепторные воздействия, могут меняться. Прямой эксперимент по наблюдению за направлением электронных переходов в контактирующих слоях заключается в измерении группы электрофизических свойств слоёв PbN_6 - окисел, и прежде всего - измерения T -э.д.с. и эффектов выпрямления на слоях непосредственно в поле излучения.

Описанные электрофизические измерения представляют, по сути, исследование по разделению зарядов в фотоэлементе с р-п переходом (или контактной неоднородностью другого вида), работающем в двух режимах: вентильном (измерения T -э.д.с.) и близком к фотодиодному (измерения вольт-амперных характеристик).

В слоях PbN_6 - NiO и PbN_6 - Co_2O_3 при облучении запорным является направление тока от азида к окиселу. Так как PbN_6 - фотопроводник р-типа [5], то подобная картина может наблюдаться лишь в случае перехода электронов из окисла в PbN_6 (переходу дырок мешает контактный барьер). В слоях PbN_6 - ZnO и PbN_6 - CdO , где контактная область антizапорная, должен иметь место обратный переход электронов - из PbN_6 в окисел.

Облучение слоёв в отсутствие внешнего поля должно приводить к разделению пар электрон-дырки на контактах и вследствие этого - к возникновению T -э.д.с. Неосновные носители (электроны в PbN_6), образующиеся на расстоянии от кон-

такта, не превышающем длину свободного пробега, подхватываются контактным полем и переносится из одного вещества в другое до установленного равновесия, при котором ток через контакт прекратится. Экспериментальные данные показали, что

PbN_6 в контакте с ZnO и CdO приобретает положительный потенциал, а в контакте с NiO — отрицательный. Эти данные коррелируют с картиной токовых измерений и также подтверждают высказываемое мнение о том, что в поле излучения в слоях $PbN_6 - ZnO$ и $PbN_6 - CdO$ окисел выступает акцептором электронов, а в слоях $PbN_6 - NiO$ и $PbN_6 - Co_2O_3$ — донором.

В соответствии с ранее высказанными предположениями, ZnO и CdO должны ускорять, а NiO и Co_2O_3 — замедлять радиолиз PbN_6 . Изложенные в данной работе экспериментальные факты вполне согласуются с этим.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ю.А.Захаров, В.А.Невоструев. Сб."Радиационная физика неметаллических кристаллов", Киев, 1965, Изд."Наука", 1967, стр. 397.
2. Ю.А.Захаров, В.А.Невоструев, ЖФХ, 41, № 4, 1968; Кинетика и катализ, 8, 210, 1967.
3. Ю.А.Захаров, В.А.Невоструев, С.М.Рябых, Сб."Труды молодых ученых — химиков", Томск, 1967"(в печати)
4. С.М.Рябых, Ю.А.Захаров, АВЭ (в печати)
5. Г.Г.Савельев, Ю.В.Гаврищенко, Ю.А.Захаров. Изв. ВУЗов, "Физика", № 7, (1968)